# האוניברסיטה העברית בירושלים

## סילבוס

# מעבדת מדידות מיקרואלקטרוניקה - 83412

*תאריך עדכון אחרון 17-08-2023*

*נקודות זכות באוניברסיטה העברית: 3*

*תואר:* בוגר

*היחידה האקדמית שאחראית על הקורס:* פיסיקה יישומית

*השנה הראשונה בתואר בה ניתן ללמוד את הקורס: 0*

*סמסטר:* סמסטר א'

*שפת ההוראה:* עברית

*קמפוס:* קרית א"י ספרא

*מורה אחראי על הקורס (רכז):* דר גלעד מרכוס

*דוא"ל של המורה האחראי על הקורס:* gilad.marcus@mail.huji.ac.il

*שעות קבלה של רכז הקורס:* בתאום מראש

*מורי הקורס:*

ד"ר לירון שטרן

*תאור כללי של הקורס:*
*אפיון רכיבים בסיסיים של מיקרואלקטרוניקה: דיודות, טרנזיסטורי CMOS,טרנזיסטור ביפולרי, SCR. הניסויים יכללו מדידות ביצועי ההתקנים ותלותם בפרטי המבנה של ההתקנים ותנאי הפעלתם.*

*מטרות הקורס:*
*ידע בסיסי במדידות אלקטרוניות ומדידות רכיבים*

*תוצרי למידה*
*בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים:*
*לאפיין רכיבים בסיסיים כמו דיודות CMOS וטרנזיסטורים*

*דרישות נוכחות (%):*
*100*

*שיטת ההוראה בקורס:* *דוח מקדים*
*ביצוע ניסויים וכתיבת דוח מסכם*

*רשימת נושאים / תכנית הלימודים בקורס:*
*ראה מטרות הקורס*

*חומר חובה לקריאה:*
*בהתאם להנחיות מדריכי המעבדה*

*חומר לקריאה נוספת:*
*NA*

*מרכיבי הציון הסופי :*
*השתתפות פעילה / עבודת צוות 40 %*
*מטלות הגשה במהלך הסמסטר: תרגילים / עבודות / מבדקים / דוחות / פורום / סימולציה ואחרות 50 %*
*הערכת מנחה אישי / המדריך / הצוות 10 %*

*<u>מידע נוסף / הערות:</u>*
*הרכב הציון:*
*10% דוח מקדים*
*40% איכות הניסוי*
*50% דוח מסכם*